

MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE À TRANSMISSION (TEM)

FABRICANT : JEOL

MODÈLE : JSM 2100-F

Échantillons

- Les échantillons sont préparés à l'aide d'un faisceau ionique focalisé dédié à la préparation de lames minces

Analyses

- Imagerie à haute résolution (fond sombre et fond clair)
- Équipé d'un canon à effet de champs fonctionnant à une tension d'accélération de 200 kV et 100 kV
- Résolution latérale : 0.19 nm

Caractéristiques

- Équipement unique au Canada muni d'un canon à effet de champs capable d'une très grande résolution pour l'imagerie et les cartographies rayons X et PEELS

VARIANTES

Spectrométrie à rayon X à sélection d'énergie (EDS) pour l'analyse chimique

- Analyses qualitatives et quantitatives
- Cartographie possible

Spectrométrie de perte d'énergie des électrons transmis à collection parallèle (PEELS) pour l'analyse chimique et la mesure d'épaisseur

- Analyses qualitatives et quantitatives
- Cartographie possible

Analyse cristallographique